nexensor

Product Catalog

미래를 측정하는 센서, 넥센서

KOR

Equipment | System | Module

Our Story

미래를 측정하는 센서. NEXENSOR

넥센서는 반도체(Advanced Package)
공정에 차별화된 3D 광 계측 토탈 솔루션을 제공합니다.

NEXENSOR Application

Optical Metrology
Reliable Data Service

광 계측
원천기술

회로 및
광학 설계

측정 알고리즘
SW기술

Equipment

Advanced package 공정의 기준 계측장비

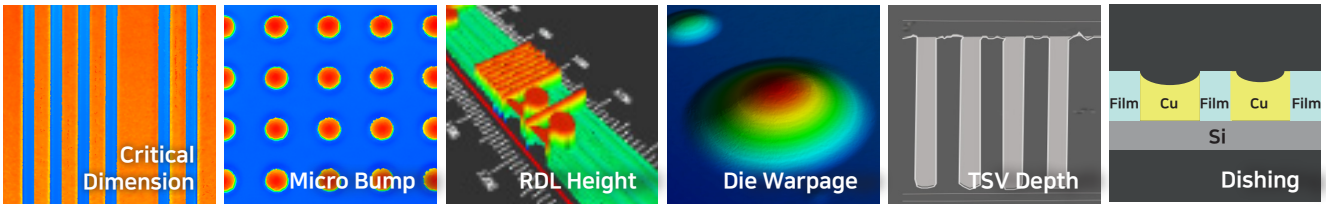
Measurement Equipment for Advanced Package

미세 TSV Depth 측정

고속 Die Warpage 측정

**RDL Height,
CD, Bump Height 측정**

Application



Equipment

Wafer Warpage 측정장비

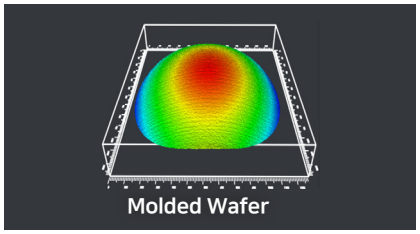
Measurement Equipment for Wafer Warpage

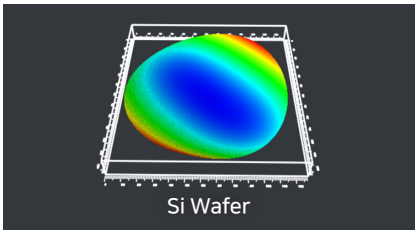
세계 최초 12" Wafer 전면 측정으로 기존의 Point 측정방식이 아닌 Wafer 전면을 측정하여 정확한 측정 데이터 제공

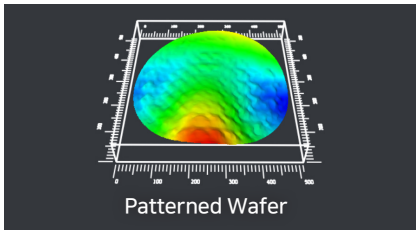
Silicon & Glass Wafer와 Patterned Wafer 의 휘어짐 측정 가능

4 ㎜ 이상의 Warpage 측정도 가능하며 1 ㎛ 이하의 반복능으로 정확한 측정 가능

Application


Molded Wafer


Si Wafer


Patterned Wafer

System

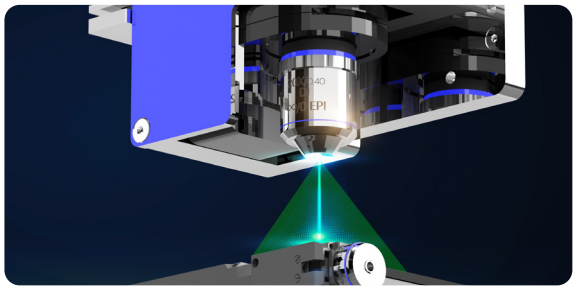
*n*XI-5SC

백색광 간섭 3D 측정기

White Light Interference Measurement System

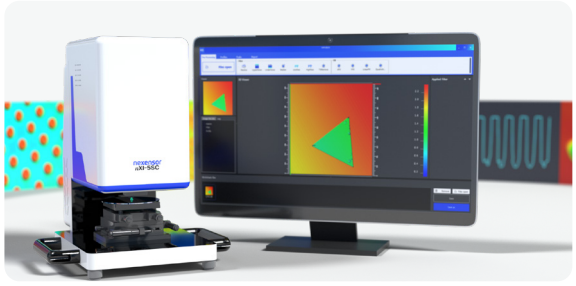
WLI 기반 초정밀 측정가능

수준 높은 측정기술이 결과에 대한 높은 신뢰성을 제공합니다.



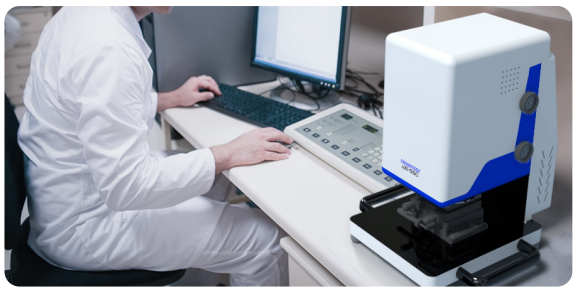
User Friendly S/W

사용자 편의성이 극대화된 프로그램으로 3D 높이, 거칠기 등 다양한 파라메타를 제공합니다.

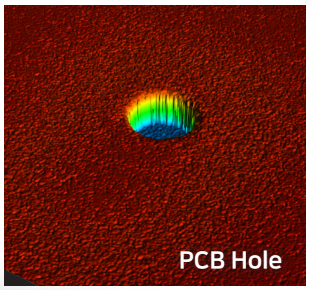


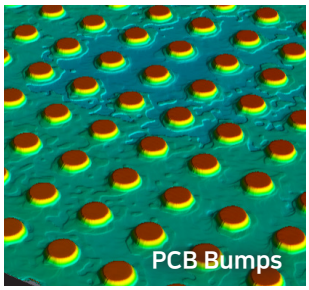
학교 및 분석실 사용 최적화

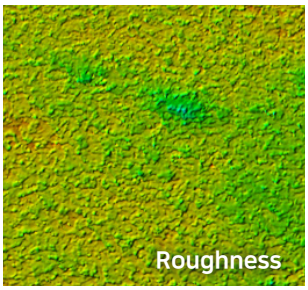
예산문제로 도입을 주저하는 업체를 위한 제품입니다. 기존 백색광 간섭계 성능을 유지하면서, 합리적인 가격으로 누구나 쉽게 사용이 가능한 제품입니다.

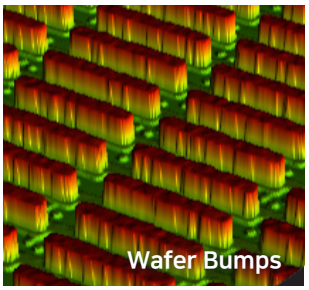


Application







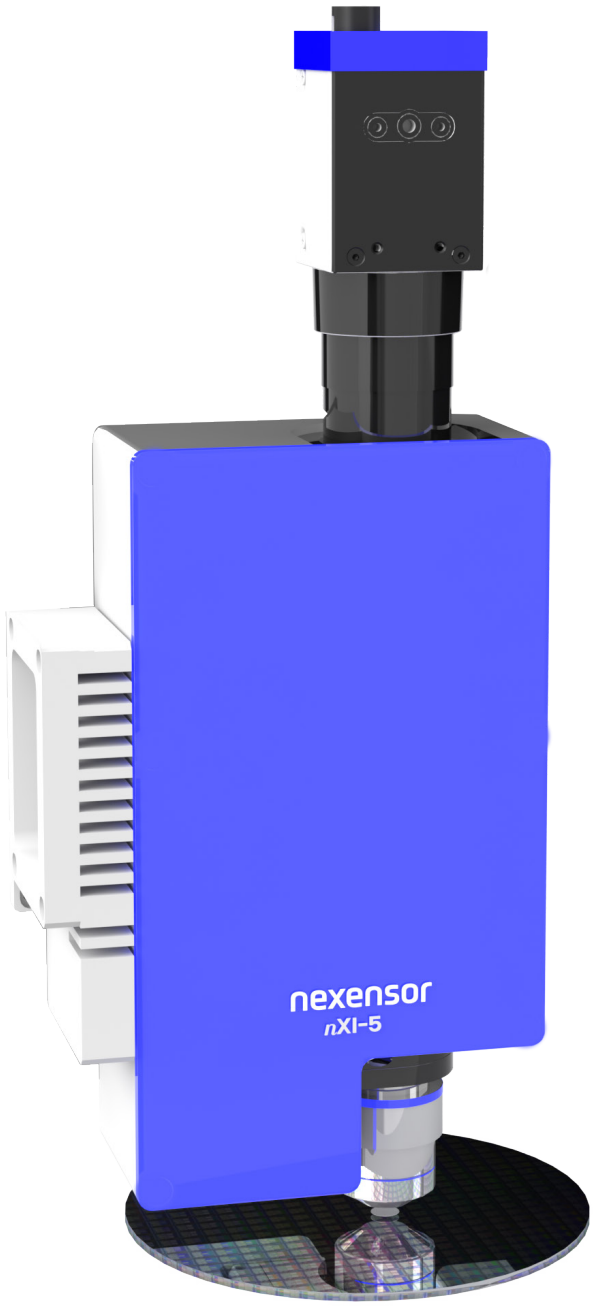


Module

*n*XI-5 Series

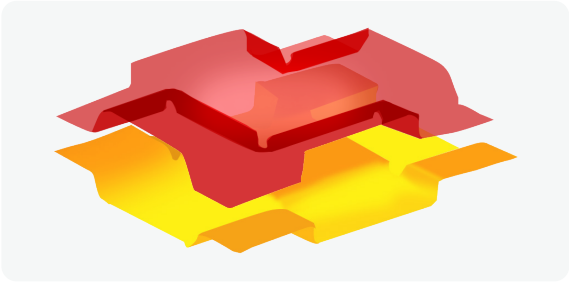
백색광 간섭 변위 측정 센서

White Light Interference Measurement Sensor



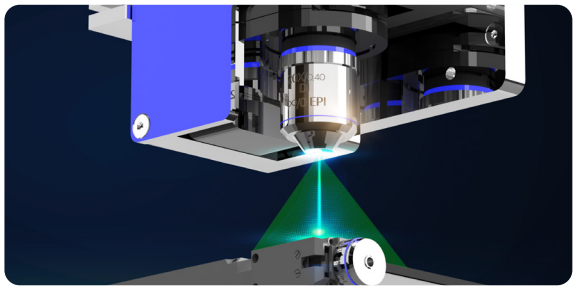
실시간 막 분리 측정 알고리즘 기술 적용으로 생산효율 극대화

정밀한 측정이 가능한 제품으로 신뢰성 있는 데이터를 제공해 공정의 효율을 높여 효과적인 생산 품질 개선이 가능합니다.



WLI 기반 초정밀 측정가능

기존보다 훨씬 빠른 측정 속도로 양산 라인에 적용하기 매우 편리하며 수준 높은 측정기술이 결과에 대한 높은 신뢰성을 제공합니다.



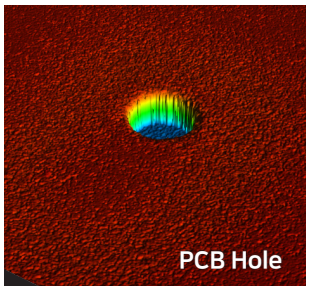
사용 목적 및 공간에 따른 다양한 Line-up

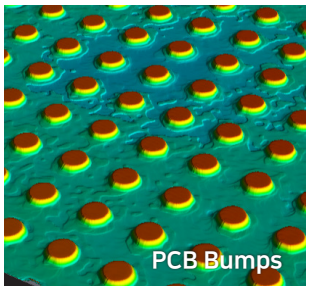
터렛 타입

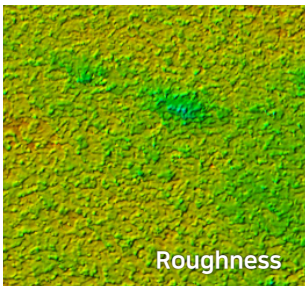
콤팩트 타입

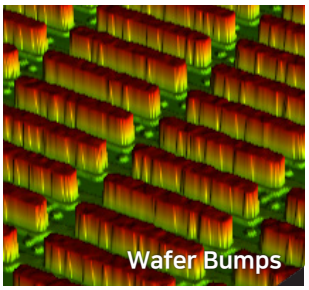
현미경 타입

Application







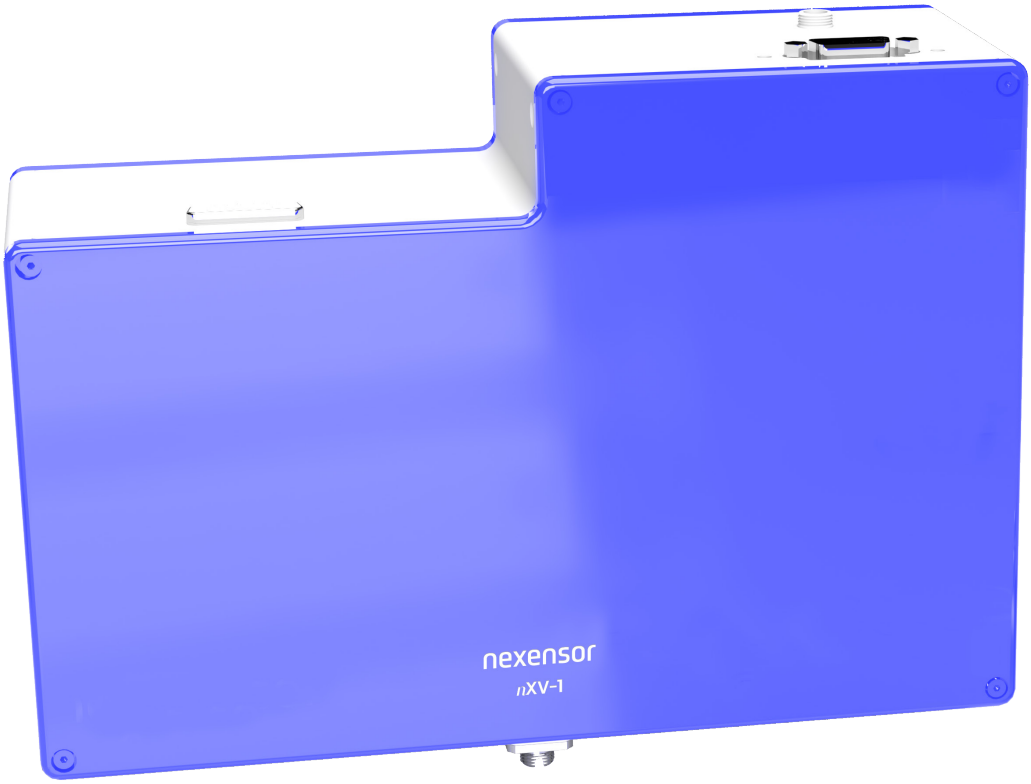


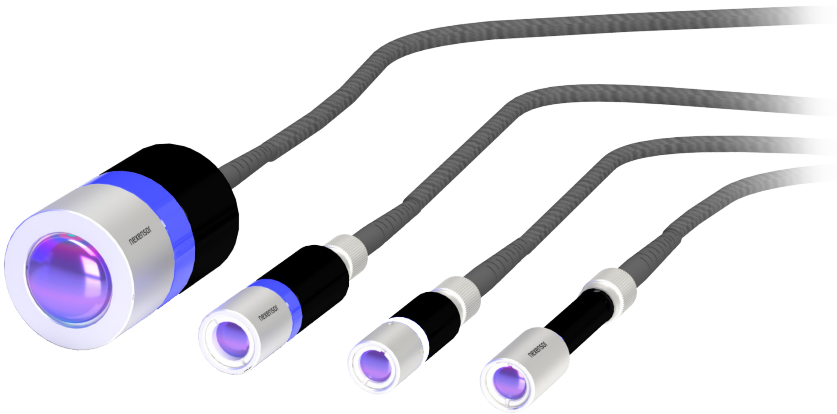
Module

*n*XV-1

분광 간섭 레이저 변위 측정 센서

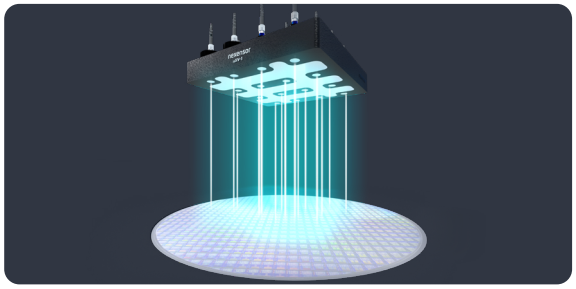
Spectral Interference Displacement Laser Sensor





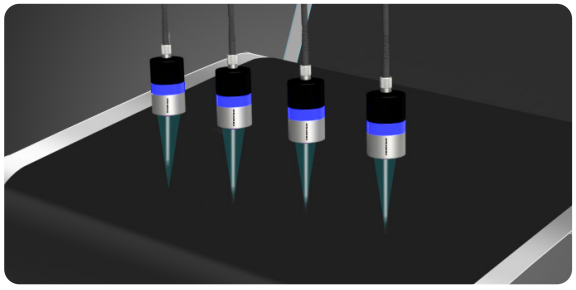
멀티채널 확장 가능

최대 16ch. 프로브 장착으로 많은 포인트 측정이
필요할 경우 확장성이 쉽습니다.



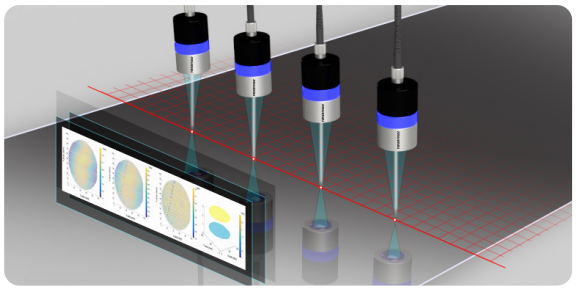
빠른 측정 속도로 양산라인 적용 가능

빠른 측정으로 움직임에 따른 노이즈 발생을
최소화 하여 다양한 양산라인에 활용이 가능합니다 .

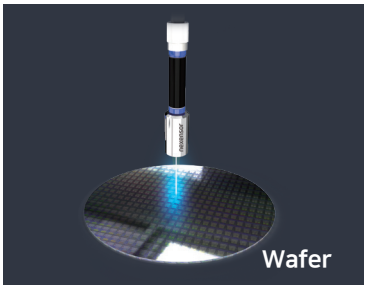


다층막에 대한 정확한 분리 측정

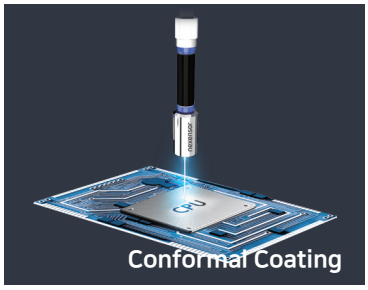
막분리가 가능해 표면에 다양한 코팅면이
존재하더라도 정확한 표면 분리가 가능합니다.

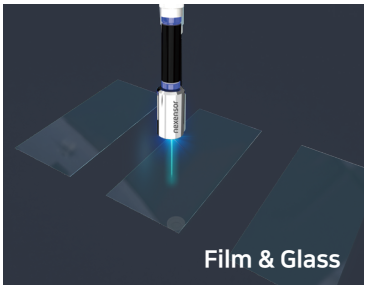


Application



Si, Glass, SiC Wafer
Thickness & Warpage





Thickness

Module

*n*XI-2

대면적 백색광 간섭 변위 측정 센서

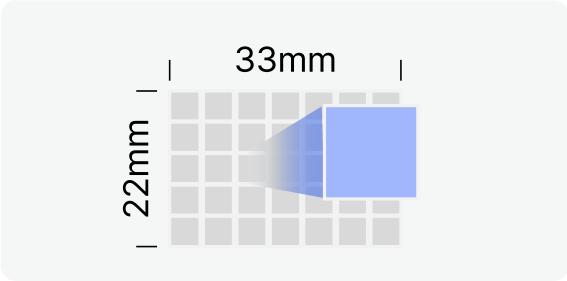
White Light Interference Measurement Sensor

기존 간섭 측정보다 10배 빠른 속도

대면적을 보다 빠르게 측정하여 얻은 고해상도의 공정효율 향상과 생산 품질 개선이 가능합니다.

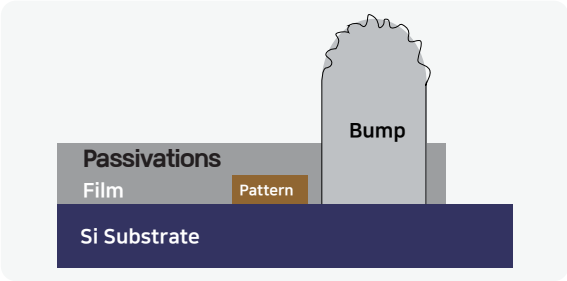
한번에 대면적 측정 가능 (33 ㎜ × 22 ㎜)

넓은 영역을 빠른 속도로 측정해 양산 라인에 적용하기에도 매우 편리하며 수준 높은 측정기술이 높은 신뢰성을 제공합니다.

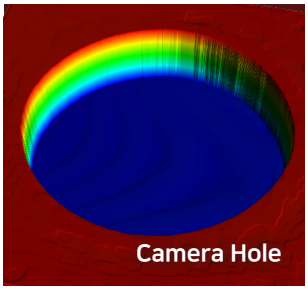


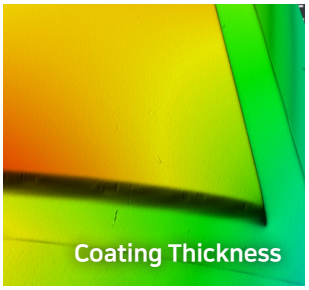
막분리 측정 기능이 탑재되어 정확한 표면 측정 가능

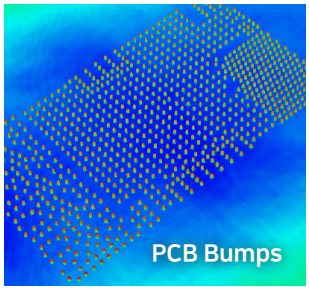
반도체·디스플레이 등 투명막 구조의 측정에 탁월한 결과를 나타냅니다.

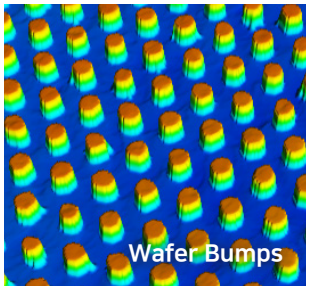


Application







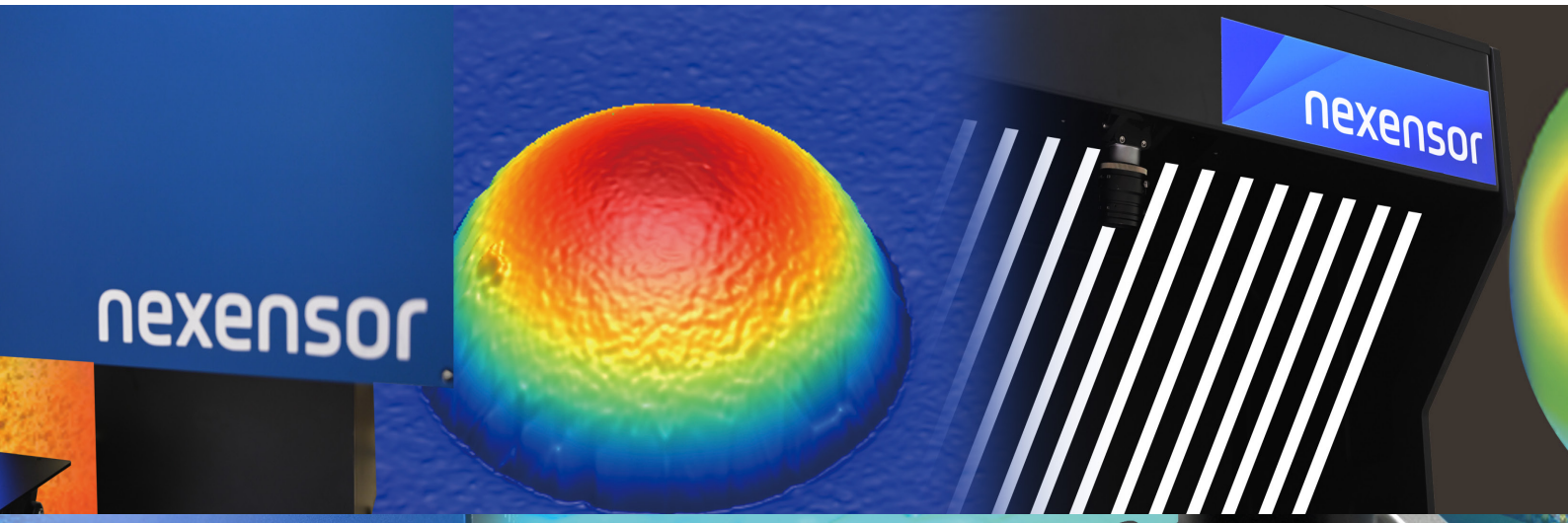


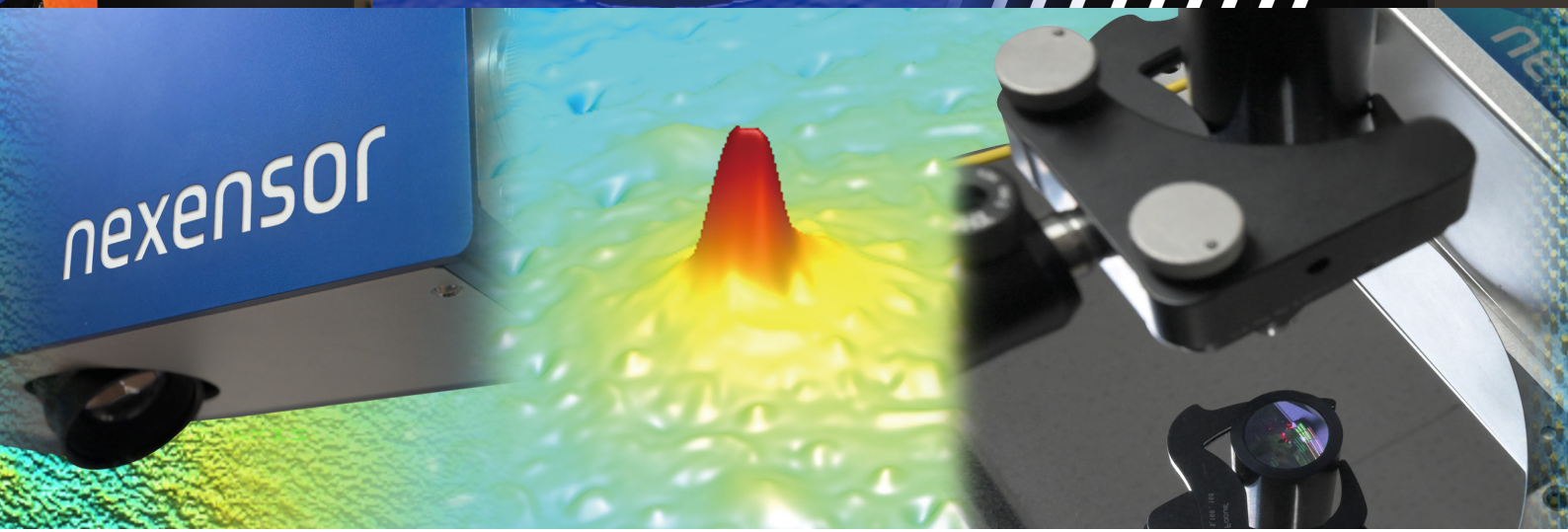
NEXENSOR Vision

누구나 쉽고 빠르게 측정 할 수 있는 계측 센서 제공

PROVIDING USER-FRIENDLY MEASUREMENT SENSORS FOR EVERYONE

넥센서는 센서시장에 혁신을 가져올 수 있는 창의성과 열린 마인드를 가진 기업 입니다.
항상 고객과 함께하고 고객의 가치에 믿음을 더해줄 수 있도록 연구 개발 하겠습니다.





측정 시스템 업그레이드

측정 설비의 정확도 점검
정기적인 검/교정을 수행하여 설비의 정밀도와 효율을 유지시키고 측정 결과의 정확도를 보정합니다.

측정 시스템 소프트웨어 고객 맞춤 프로그래밍
소프트웨어 기능의 업그레이드를 통해 최대한 고객의 요구를 만족시키고 다양한 전문적인 소프트웨어 제작 지원으로 측정 효율을 높여 줍니다.

측정 설비 유지관리
수준 높은 유지관리를 위해 측정기의 사용수명을 연장시켜 줍니다.
또한 충분한 소모성 부품을 확보하여 고장 시 신속한 대응이 되도록 준비하고 있습니다.

샘플 측정 테스트
구매 전 샘플 측정 가능 여부를 테스트 해보신 적용 가능한 제품을 선정을 도와 줍니다. 측정하고자 하는 제품을 전달해주시면 테스트 서비스를 진행해드리고 있습니다.

기술 교육 및 교류
고객의 사용 특성에 따라서 맞춤형 교육 과정과 기술적인 문제해결을 통하여 고객의 신속한 측정기술 파악을 돕고 테스트 효율을 향상시켜 줍니다.

nexensor

(주)넥센서 Nexensor Inc.

대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 70
(전민동, KT대덕2연구센터) 3동 404, 407호 우)34047
3-404, 407, 70, Yuseong-daero 1689beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon, 34047, ROK

T. +82-42-710-7760 / F. +82-42-710-7761
Email. sales@nexensor.com

넥센서 홈페이지 www.nexensor.com

2402-Total Cat-KOR-ver.1